


國立交通大學  
電子物理研究所  
碩士論文

掃描式探針顯微術 (SPM) 於氮化鎵薄膜  
表面微結構之電性研究



Studies of micro-structures on GaN  
surface by scanning probe  
measurement

研究生：何志偉

指導教授：陳衛國 教授

中華民國九十三年六月

掃描式探針顯微術 (SPM) 於氮化鎵薄膜  
表面微結構之電性研究

Studies of micro-structures on GaN  
surface by scanning probe measurement

研究生：何志偉

Student: Chih-Wei Ho

指導教授：陳衛國 教授

Advisor: Prof. Wei-Kuo K. Chen



A Thesis  
Submitted to Institute of Electrophysics  
College of Science  
National Chiao Tung University  
in Partial Fulfillment of the Requirements  
for The Degree of Master of Physics  
in  
Electrophysics  
June 2004  
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月